

IGBT静态参数测试仪

产品名称	IGBT静态参数测试仪
公司名称	西安天光测控技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:天光测控 型号:ST-SP_X
公司地址	陕西省西安市高陵区泾环北路1798号11-303
联系电话	15596668116

产品详情

产品系列晶体管图示仪半导体分立器件测试筛选系统静态参数测试仪（包括IGEs/VGE(th)/VCEsat/VF/IC Es/VCEs等）动态参数测试仪（包括Turn_ON&OFF_L/Qrr_FRD/Qg/Rg/UIS/SC/RBSOA等）环境老化测试（包括HTRB/HTGB/H3TRB/Surge等）热特性测试（包括PC/TC/Rth/Zth/Kcurve等）可测试Si/SiC/GaN材料的IGBTs/MOSFETs/DIODEs/BJTs/SCRs等功率器件

ST-SP3020 功率器件静态参数测试系统用于测试 IGBTs,MOSFETs, Diode,静态直流参数3000V/2000A

产品简述 ST-SPX系列产品是主要针对半导体功率器件的静态参数测试而开发设计。通过DUT适配器的转换，可实现对各种封装形式的IGBTs，MOSFETs，DIODEs等半导体器件的静态电参数测试，包括器件、模块以及DBC衬板和晶圆。设备融入了自动化及智能化的设计理念及功能，支持批量上下料并进行全自动测试。用于规模化量产可节省人力并提高测试产能，适合产线量测以及器件研发设计阶段的实验室测试，设备由主控计算机操控，测试数据自动上传以及保存。测试能力包含输出特性、转移特性、击穿特性、漏电流、阈值电压、二极管压降等。产品功能及输出功率进行了模块化设计，满足用户潜在的后期需求，*高测试电压电流可扩展至10KV/10KA，变温测试支持常温到200。测试能力产品特点

产品以2000A为一个电流模块,以1000V为一个电压模块，可升级到10KA/10KV. 可以连接探针台做 wafer / chip 测试，也可以安装夹具及适配器做模块测试 针对不同结构的封装外观，通过更换 DUT适配器即可可进行室温~200 变温测试,也可实现子单元测试功能

测试软件具有实验模式和生产模式,测试数据可存储为Excel文件 栅极电阻可任意调整 系统测试性能稳定,适合大规模生产测试应用（24hr 工作）支持半自动和全自动测试 采用品牌工控机，具有抗电磁干扰能力强，排风量大等特点 安全稳定（PLC 对设备的工作状态进行全程实时监控并与硬件进行互锁）

自动化，单机测试时只需手动放置DUT，也可连接机械选件实现自动化测试线

智能化，通过主控计算机进行操控及数据编辑，测试结果自动保存及上传指定局域网

安全性，防爆，防触电，防烫伤，短路保护等多重保护措施，确保操作人员、设备、数据及样品安全。

